CHOTEST · SUPERVIEW-W3

Perfilômetro óptico 3D SuperView W3

Perfilômetro óptico 3D de piso por interferometria de luz branca, com mesa XY motorizada de Φ400 mm, curso de 300 × 300 mm e capacidade de 20 kg. Mede forma e rugosidade sem contato em escala nanométrica e aceita wafers de 6", 8" e 12".



MESA XY: CURSO	EIXO Z: CURSO	PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO	FONTE DE LUZ
300 × 300 mm	**100 mm**	**Interferometria de luz branca**	**LED branco**

VISÃO GERAL

O SuperView W3 é um perfilômetro óptico 3D sem contato, de piso, que usa interferometria de luz branca para medir forma e rugosidade em escala nanométrica em peças e wafers de maior porte. Um módulo de varredura no eixo Z percorre a superfície e o software XtremeVision reconstrói a imagem 3D, da qual saem os parâmetros 2D e 3D de qualidade superficial.

O W3 é o modelo de maior mesa da linha: Φ400 mm, curso de 300 × 300 mm e capacidade de 20 kg, com ajuste de inclinação motorizado de ±5°. O equipamento mede 1000 × 800 × 1550 mm e pesa 750 kg. Aceita wafers de 6", 8" e 12", com troca automática entre os três tamanhos de mandril a vácuo por um comando.

Funções voltadas a semicondutores descritas no brochure da série W2/W3:

- medição do perfil de canais abertos por laser na etapa de corte (dicing);
- medição de degrau de filmes em wafers, de 1 nm a 1 mm;
- medição de rugosidade de lâminas de silício após a retificação, com média de dezenas de pequenas áreas em um comando;
- medição automática por um comando.

A torre motorizada recebe cinco objetivas (10X de série; 2,5X, 5X, 20X, 50X e 100X opcionais), o eixo Z tem curso de 100 mm e a varredura vertical chega a 10 mm. A versão W3-Ultra tem campo de visão padrão de 1,1 × 1,1 mm e velocidade de varredura de 16 µm/s, contra 0,98 × 0,98 mm e 5 µm/s do W3.

A instalação requer ar comprimido a 0,6 MPa, isento de óleo e água, piso com vibração VC-C ou melhor e ambiente sem campo magnético forte nem gás corrosivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Princípio de medição	Interferometria de luz branca
Fonte de luz	LED branco
Sistema de vídeo	1024 × 1024
Objetivas	10X de série; 2,5X, 5X, 20X, 50X e 100X opcionais
Zoom óptico	0,5X de série; 0,375X, 0,75X e 1X opcionais
Campo de visão	0,98 × 0,98 mm (padrão, W3); 1,1 × 1,1 mm (W3-Ultra)
Torre de objetivas	Motorizada, 5 posições
Mesa XY: tamanho	Φ400 mm
Mesa XY: curso	300 × 300 mm
Mesa XY: capacidade de carga	20 kg
Ajuste de inclinação	±5° (motorizado)
Eixo Z: curso	100 mm
Acionamento da mesa XY e do eixo Z	Motorizado
Faixa de varredura em Z	10 mm
Repetibilidade de topografia de superfície	0,1 nm (wafer de silício Sa 0,2 nm, em laboratório)
Repetibilidade de rugosidade RMS	0,005 nm (wafer de silício Sa 0,2 nm, ISO 25178, em laboratório)
Medição de degrau (altura)	Exatidão 0,3%; repetibilidade 0,08% (1σ). Bloco padrão de degrau de 5 µm, em laboratório
Velocidade de varredura	5 µm/s (W3); 16 µm/s (W3-Ultra), com resolução de 0,1 nm
Dimensões	1000 × 800 × 1550 mm (C × L × A)
Peso	750 kg
Temperatura de operação	0 °C~30 °C, variação < 2 °C/60 min
Umidade de operação	5%~75% UR, sem condensação
Vibração e ruído do ambiente	VC-C ou melhor; ruído avaliado pelo software 3σ ≤ 4 nm. Com 4 nm ≤ 3σ ≤ 10 nm o fabricante rebaixa a repetibilidade de rugosidade RMS para 0,015 nm, a exatidão de degrau para 0,7% e a repetibilidade de degrau para 0,12%; com 3σ > 10 nm o local não atende ao requisito de uso
Ar comprimido	0,6 MPa, isento de óleo e água, mangueira de 6 mm de diâmetro
Alimentação	AC 100~240 V, 50/60 Hz, 300 W

Especificações informadas pelo fabricante, sujeitas a alteração sem aviso prévio. Confirme a configuração na proposta. Versão 11/2026.

FALE COM A PROBE

Proposta, configuração e suporte técnico no Brasil, com a equipe da Probe Systems.

- Indicação do modelo para a sua peça e tolerância
- Proposta com a configuração para a sua aplicação

(11) 4942-2222 · WhatsApp **(11) 96841-6776**
vendas@probesystems.com.br · probesystems.com.br
Rua Waldemar Martins Ferreira, 289 · São Bernardo do Campo, SP

Página do produto, vídeos e cotação